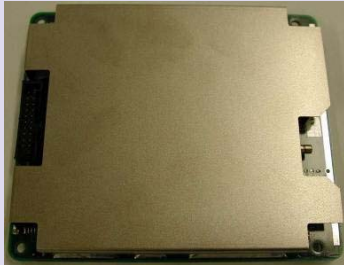




投資抑制時期のベストソリューション

既存テストに新たな測定機能をアドオンし、テスト対象デバイスの拡大を実現します。頻繁に使用する機能を汎用品として多数ラインアップしました。測定可能デバイスの拡大だけでなく、同時測定数の拡大にも威力を発揮します。



Jitter測定 **Ytip**



AD/DA **Ytip**

テスト機能拡張

❖ **Ytip** (Yokogawa Test Intellectual Property)とはプローブカード、PFBに取り付けるコンポーネント(BOST)です。弊社テストだけでなく、他社テストとの接続も可能です。

充実のラインナップ

- ❖ 電源 **Ytip**
- ❖ 拡張電源 **Ytip** (開発中)
- ❖ Jitter測定 **Ytip**
- ❖ AD/DA **Ytip**
- ❖ 電圧ブースター **Ytip**
- ❖ その他

投資抑制時期のベストソリューション

テスト投資やエンジニア採用が抑制されている中、トータルテストコストを削減します。

設備コスト、エンジコストの削減

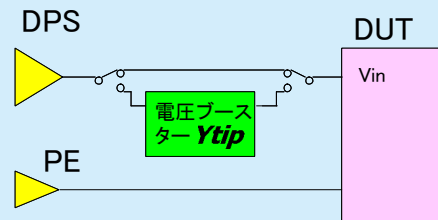
- ❖ キーとなるテストを**Ytip**で測定できれば、新しいテストを買う必要はありません。
- ❖ **Ytip**の使用に当たって、新規言語や開発環境の習得する必要がないので、導入がスムーズです。

構成例

Ytipを使用し、既存テストを特定デバイス向けテストに再構築する例を示します。

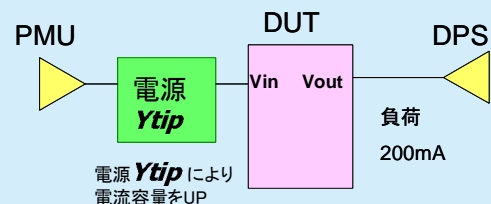
電源関連IC用

- ❖ IOピン数が少なく、出力周波数の高くない古いロジックテストに、多数の電源**Ytip**を実装し、超多電源テストを構築します。
- ❖ FPGAや携帯電話向け電源IC、電源監視IC、LEDドライバICのような、小ピンで多電源や小ピンで大電流が必要なデバイスの多数個同時測定を実現します。



高電圧ドライバICへの適用
ロジックテストにて50V超の電源を実現
測定項目:コンタクト、リーク、電源電流(動作・静止)

高電圧ドライバIC用構成例



電源**Ytip**により
電流容量をUP

DPS以外の大電流容量PINを増やすことにより、多数個同時測定を可能とします。

電源関連IC用構成例

お問い合わせ

詳細につきましては、下記までお問い合わせください。
横河テストソリューションズ株式会社
営業マーケティング本部
〒180-8750 東京都武蔵野市中町2-9-32
TEL:0422-52-9770